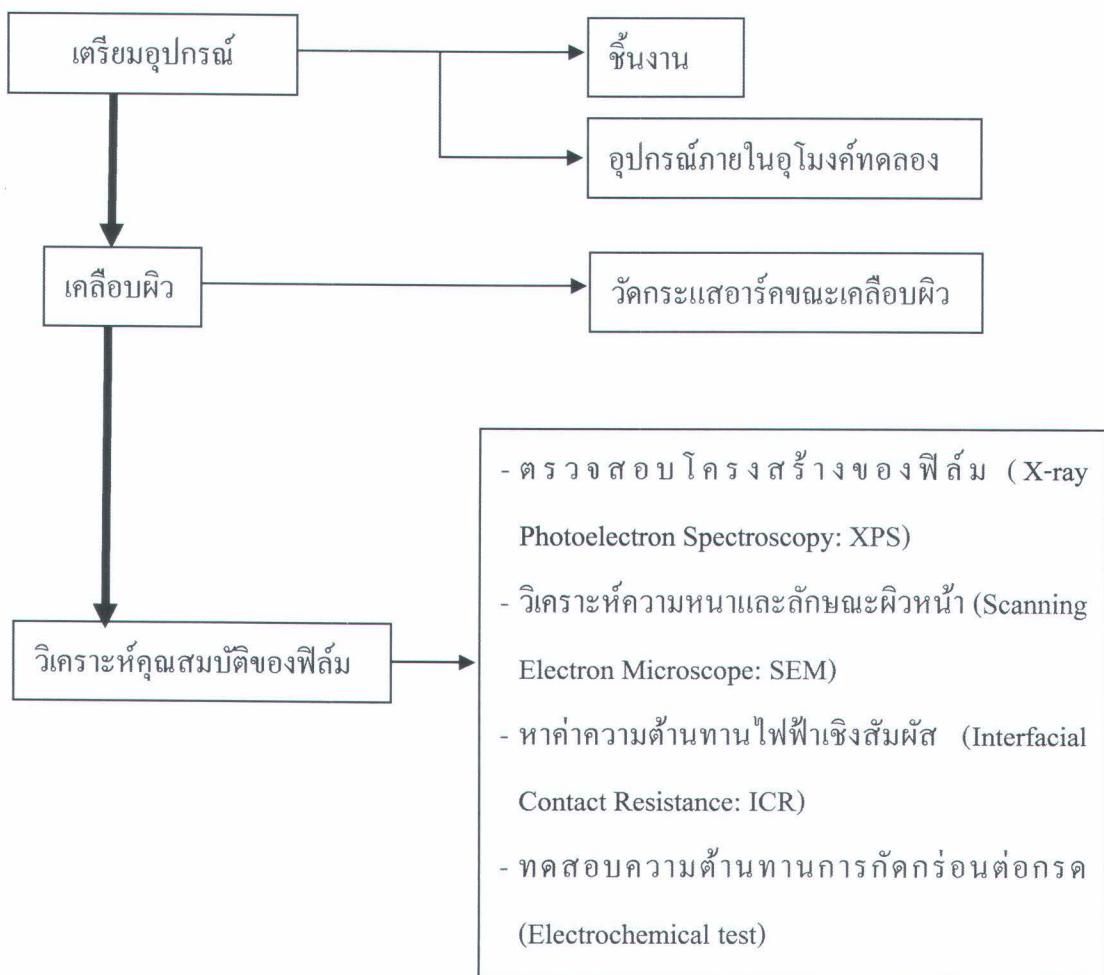


บทที่ 3 วิธีการวิจัย

การทดลองนี้ใช้เครื่องกำเนิดพลาสม่าแบบฟิลเตอร์แคร็ติกอาร์คในสัญญาากาศ ชนิดไม่ใช่ทริกเกอร์อิเล็กโทรด เคลือบผิวชั้นงานสเตนเลสสตีลชนิด 304 และชั้นงานแผ่นซิลิโคน โดยใช้โลหะไทเทเนียมเป็นจุดกำเนิดพลาสม่าในบรรยากาศของไนโตรเจน โดยมีกระบวนการทดลองทั้งหมดดังนี้

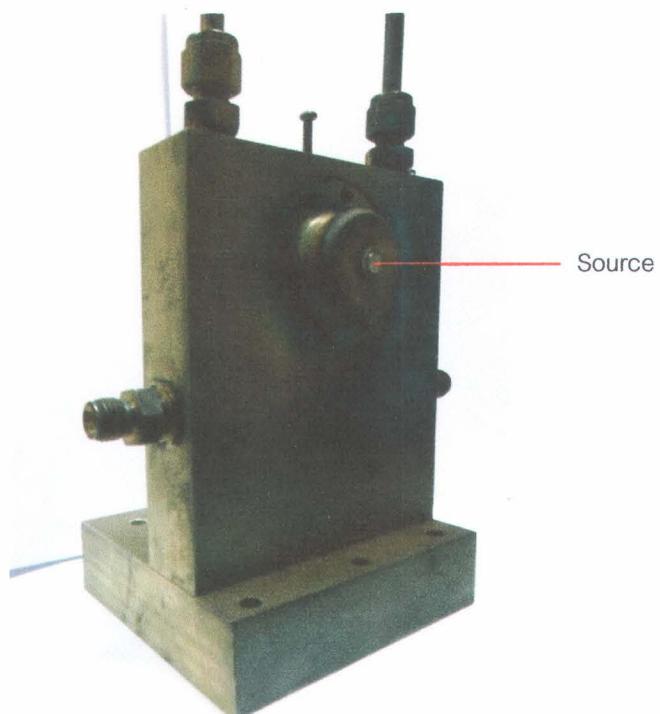


3.1 อุปกรณ์การทดลอง

การติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมงค์ทดลองประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ แหล่งกำเนิดพลาสม่า ฟิลเตอร์ และชิ้นงาน รวมทั้งการติดตั้งสายไฟระหว่างแต่ละอุปกรณ์ การทำให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนทำการทดลองทุกครั้ง เพราะเมื่อปิดฝาอุโมงค์ทดลองและเริ่มเข้าสู่ระบบสุญญากาศแล้ว จะไม่สามารถเปิดฝาอุโมงค์เพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในได้จนกว่าจะปิดระบบปั๊มสุญญากาศและปรับความดันภายในอุโมงค์ทดลองให้เท่ากับความดันบรรยายกาศ

3.1.1 แหล่งกำเนิดพลาสม่า

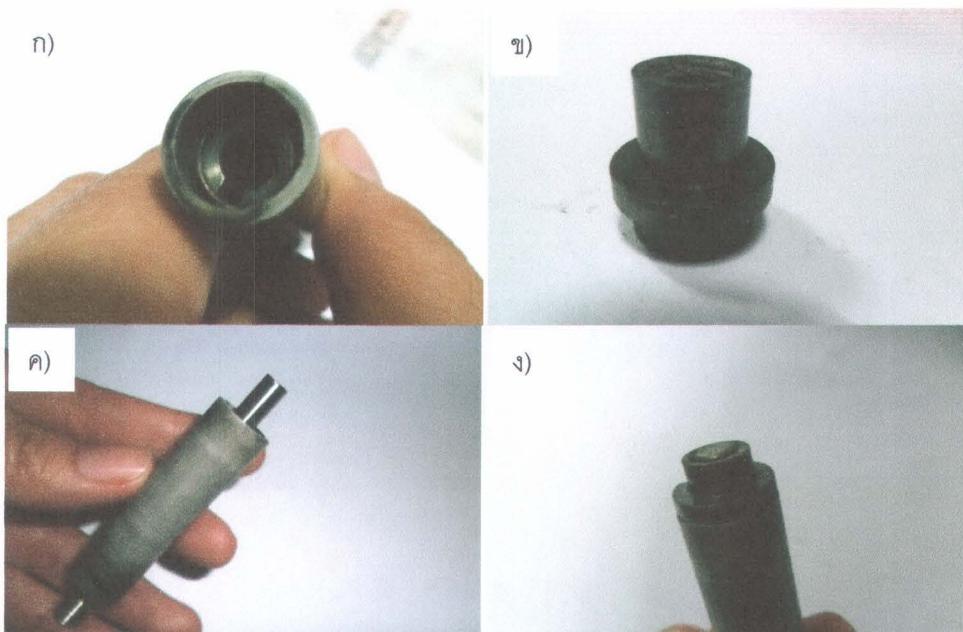
แหล่งกำเนิดพลาสม่าหรือ Source มีลักษณะดังรูป 3.1 ประกอบด้วยแท่นของ Source และส่วนของ Source ซึ่งในการทดลองนี้ใช้แท่งไทเทเนียมบริสุทธิ์ 99.99% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.95 mm ยาวไม่ต่ำกว่า 3 cm เป็นวัสดุต้นกำเนิดพลาสม่า



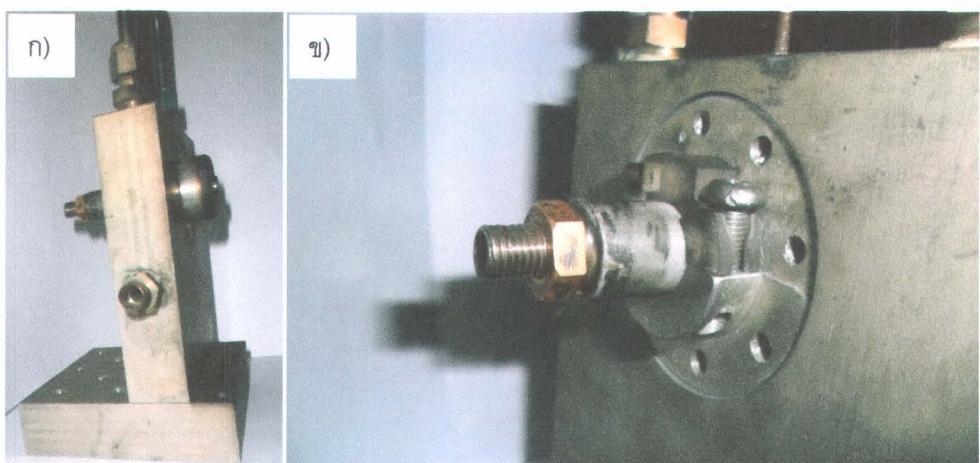
รูป 3.1 แหล่งกำเนิดพลาสม่า

แท่งไทเทเนียมจะถูกประกอบเข้ากับจำนวนที่ทำจากเซรามิก เซรามิกประกอบด้วยชิ้นที่หนึ่งและชิ้นที่สองดังรูป 3.2ก และ 3.2ข ภายในอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งมีโลหะนำไฟฟ้าสำหรับหนีบ source หรือการทดลองนี้เป็นแท่งไทเทเนียม เนื่องจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นแหล่งกำเนิดพลาสม่าแบบไม่ใช้ทริกเกอร์ เซรามิกชิ้นที่สองจึงต้องถูกฝนด้วยแกรไฟท์ หรือไส้ดินสอ เพื่อเพิ่มลดความ

ต้านทานระหว่างแอนโอดและแค็ปติก ความต้านทานระหว่างสองขั้วไฟฟ้าวัดโดยใช้โอล์มิเตอร์ ความมีค่าไม่เกิน 2000 โอล์ม เพราะอาจมีผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องระหว่างการเคลือบผิวของชิ้นงานหากความต้านทานสูงเกินไป และจะต้องเปิดฝาอุโมงค์ทดลองเพื่อนำเซรามิกชิ้นเดิมมาฝันด้วยไส้ดินสอใหม่อีกครั้ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการทดลองเพิ่มขึ้น เมื่อหนีบแท่งไทเทเนียมเข้ากับเซรามิกชิ้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกอบเซรามิกทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน ดังรูป 3.2 ก และ 3.2 ข จากนั้นนำอุปกรณ์ทั้งสองติดตั้งเข้ากับแท่น Source ดังรูป 3.3 ก และ 3.3 ข ขันนืดจับให้แน่นจึงเรียบร้อย



รูป 3.2 จำนวนที่ทำจากเซรามิก (ก) เซรามิกชิ้นที่ 1 (ข) เซรามิกชิ้นที่ 2
(ค) และ (ง) แท่งไทเทเนียมและเซรามิกทั้งสองชิ้นประกอบกัน

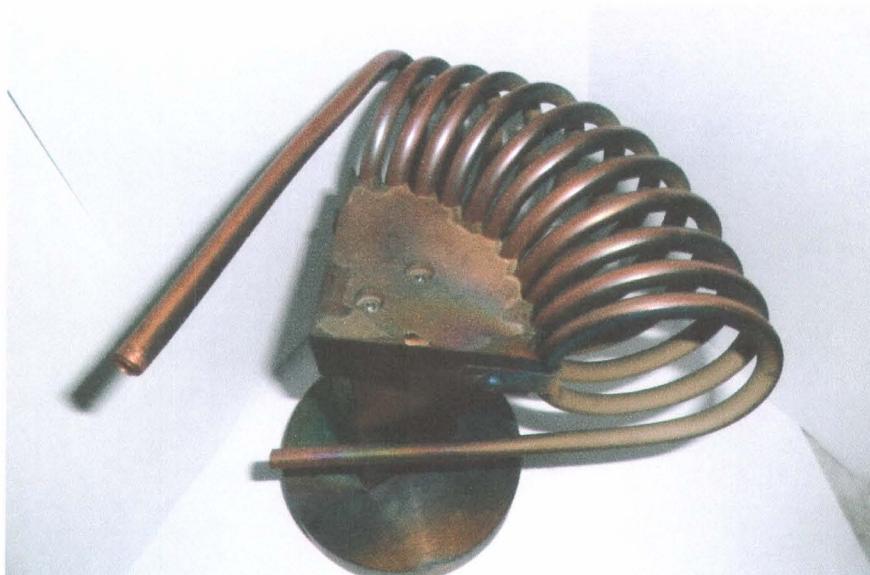


รูป 3.3 การติดตั้ง source (ก) ติดตั้งเซรามิกใส่ในแท่น source (ข) การยึดจับโดยนืดจับ

3.1.2 พิลเตอร์

พิลเตอร์ทำจากห่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.635 cm หรือ $\frac{1}{4}\text{ นิ้ว}$ และมีความหนา 1 mm ขดเป็นโซลินอยด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 cm และคัดให้โค้ง 90 องศา มีรัศมีความโค้ง 9 cm ติดตั้งเข้ากับแผ่นอะคริลิกขนาดเดียวกันนี้ส่วนสี่ของวงกลมและบีดกับแท่นดังรูป 3.4 ซึ่งทั้งแท่นและอะคริลิกล้วนเป็นชนวนทั้งหมด

เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านพิลเตอร์จะเน้นย้ำนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเบี่ยงเบนเหล่าไอออนมีประจุให้วงไปตามความโค้งของพิลเตอร์ได้ ดังที่คำนวณค่าสนามไฟฟ้าภายในพิลเตอร์ในบทที่สอง ซึ่งได้ค่าประมาณ $7.5 \times 10^{-4}\text{ T}$ ที่จุดศูนย์กลางของพิลเตอร์

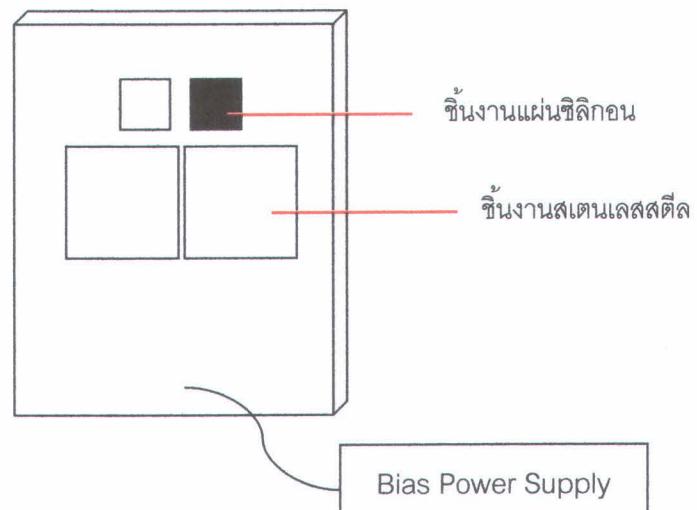


รูป 3.4 พิลเตอร์กรองอนุภาคขนาดใหญ่

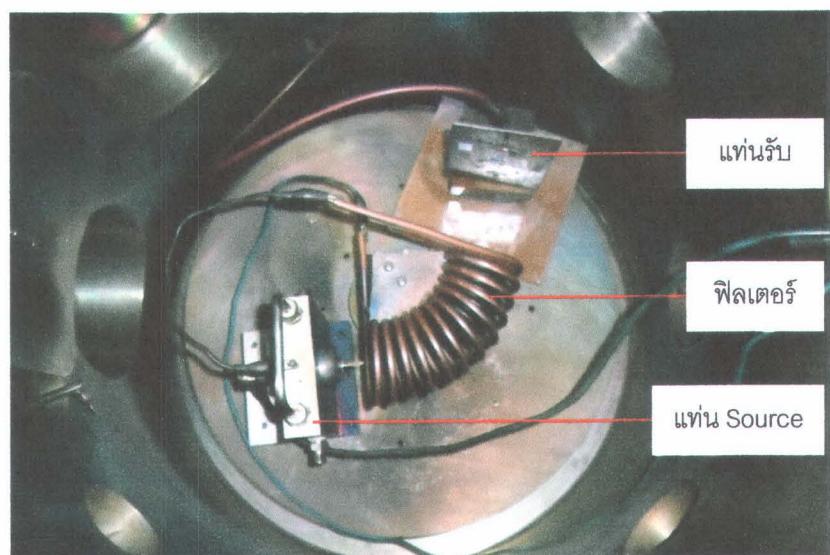
3.1.3 ชิ้นงาน

การเลือกชนิดและขนาดของชิ้นงานขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของพิล์มนบาง ผู้ทดลองเลือกใช้แผ่นสแตนเลสตีลที่มีความหนา 1 mm ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีขนาด $1 \times 1\text{ cm}^2$ ซึ่งจะใช้ตรวจสอบเฟสของพิล์มนับเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟเฟร็กชัน หรือ XRD และขนาด $2 \times 2\text{ cm}^2$ ซึ่งใช้ทดลองความต้านทานการกัดกร่อนและวัดความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสจากนั้นขัดให้เรียบเป็นมันวาวด้วยกระดาษรายเบอร์ 360, 600, 800, 1000 และ ผงอะลูมินาขนาด 1 และ $0.3\text{ }\mu\text{m}$ ตามลำดับ ก่อนล้างด้วยอะซิโนนและเอทิลแอลกอฮอล์ จากนั้นเป่าด้วยหัวฉีดลมจนชิ้นงานแห้ง เมื่อได้ชิ้นงานที่พร้อมสำหรับเคลือบผิวจึงติดตั้งกับแท่นรับ (Holder) ดังรูป 3.5

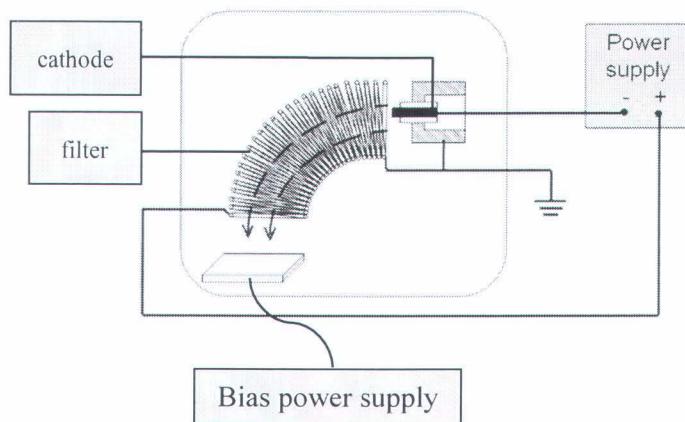
จัดอุปกรณ์ภายในอุโมงค์ทดลอง ดังรูปที่ 3.6 จัดแบ่งรับให้อยู่ระดับเดียวกันกับชั้นของพิลเตอร์ และจัดตำแหน่งของแท่น Source และพิลเตอร์ ให้ระยะห่างระหว่างปลายพิลเตอร์กับชั้นงานห่างกัน 9.0 cm และต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามวงจรในรูปที่ 3.7 เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นจึงปิดฝาอุโมงค์ทดลองเพื่อเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิวต่อไป



รูป 3.5 แผนภาพการติดตั้งชั้นงานกับแท่นรับ



รูปที่ 3.6 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ภายในอุโมงค์ทดลอง



รูปที่ 3.7 วงจรไฟฟ้าระหัวงอปรกติ

3.2 การเคลื่อนผิวชั้นงาน

ผู้ทดลองได้แบ่งกระบวนการการเคลื่อนผิวเป็นสองขั้นตอน คือขั้นตอนของระบบสุญญากาศ และขั้นตอนของระบบไฟฟ้า เป็นที่ทราบดีว่ากระบวนการการเคลื่อนผิวชั้นงานจะให้ผลลัพธ์ถ้าพลาสม่า เคลื่อนที่ในอุโมงค์ทดลองที่มีความเป็นสุญญากาศสูง เพราะอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปโดยไม่ชนกัน อนุภาคของอากาศ ทำให้โอกาสที่อนุภาคจะสูญเสียความเร็วและพลังงานจนมีน้อยลงก่อนจะวิ่งไปเคลื่อนผิวชั้นงาน เริ่มแรกจึงต้องทำให้อุโมงค์ทดลองเป็นสุญญากาศโดยการใช้ปั๊มสุญญากาศ ส่องชนิดนั้นคือ ปั๊มโรตารีและปั๊มไครโอดเจนิก มีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 วิจัตกรรมปั๊มไครโอดเจนิก

เนื่องจากว่าปั๊มไครโอดเจนิกไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานที่ความดันบรรยายกาศได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ปั๊มไครโอดเจนิกโดยการเปิดปั๊มโรตารีและวาล์วระหว่างปั๊มโรตารีซึ่งเรียกว่า Regenerate Valve ดูแผนภาพในรูปที่ 2.4 ในบทที่ 2 เป็นการประกอบ ปั๊มโรตารีจะดูดอากาศภายในปั๊มไครโอดเจนิกให้ความดันลดลงถึงระดับประมาณ 2.0×10^{-2} torr หรือต่ำกว่าวนั้น จึงปิดปั๊มโรตารีและวาล์ว และปิดคอมเพรสเซอร์เริ่มต้นการทำงานของปั๊มไครโอดเจนิก ขณะนี้ความดันภายในปั๊มไครโอดเจนิกจะลดลงจาก 10^{-2} torr ต่ำลงไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปล่อยให้ปั๊มไครโอดเจนิกเริ่มต้นทำงานหรือ “อุ่นเครื่อง” จึงเรียกขั้นตอนนี้ว่า วิจัตกรรมปั๊มไครโอดเจนิก

3.2.2 ลูดอากาศภายในอุโมงค์ทคลองด้วยปั๊มโรตารี

อุโมงค์ทคลองในตอนนี้มีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศ เมื่อเปิดปั๊มโรตารี และ Backing Valve ความดันภายในอุโมงค์จะลดลง สามารถวัดความดันภายในอุโมงค์ได้โดยอ่านที่เครื่องแสดงผล ซึ่งเชื่อมต่อ กับหัววัด CG2 เมื่อความดันเท่ากับหรือต่ำกว่า 2.0×10^{-2} torr จึงปิด Backing Valve และปั๊มโรตารี

3.2.3 ลูดอากาศภายในอุโมงค์ทคลองด้วยปั๊มไครโอลเจนิก

อุโมงค์ทคลองขั้นตอนนี้มีความดันต่ำกว่า 10^{-2} torr ซึ่งหมายความพอดีเริ่มใช้ปั๊มไครโอลเจนิก จึงเปิด Gate Valve ซึ่งเป็นวาล์วที่กันระหว่างปั๊มไครโอลเจนิกและอุโมงค์ทคลอง ความดันภายในอุโมงค์จะลดลงและสามารถอ่านค่าได้จากเครื่องแสดงผลอีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อ กับ Penning Gate เป็นหัววัดที่ความดันต่ำซึ่งติดไว้ภายในอุโมงค์ทคลอง รอบกระถังความดันเท่ากับ Base Pressure ซึ่งในการทคลองนี้กำหนดไว้ที่ 2.0×10^{-5} torr เป็นค่าเริ่มต้นทุกรั้งก่อนจะเริ่มขั้นตอนต่อไป

3.2.4 ปล่อยก๊าซในไตรเจนเข้าสู่อุโมงค์ทคลอง

ก๊าซในไตรเจนบริสุทธิ์ 99.99% ถูกปล่อยผ่านเครื่องควบคุมการไหล หรือ Mass Flow สามารถวัดอัตราการไหลได้ ในการทคลองนี้ผู้ทคลองเลือกเปลี่ยนค่าความดันของก๊าซ ในไตรเจนขณะเคลื่อนผ่านโดยพลาสม่าที่ความดันค่าดังตารางที่ 3.1 ตารางที่ 3.1 เนื่อง ไข่ของการทคลองในแต่ละชั้นงาน

ชั้นงาน	เงื่อนไข
TiN1	base pressure : 2.0×10^{-5} torr
TiN2	5.0×10^{-5} torr (หรือช่วงความดัน $4.0 - 6.0 \times 10^{-5}$ torr)
TiN3	1.0×10^{-4} torr (หรือช่วงความดัน $9.0 \times 10^{-5} - 2.0 \times 10^{-4}$ torr)
TiN4	5.0×10^{-4} torr (หรือช่วงความดัน $4.0 - 6.0 \times 10^{-4}$ torr)
TiN5	1.0×10^{-3} torr (หรือช่วงความดัน $9.0 \times 10^{-4} - 2.0 \times 10^{-3}$ torr)
TiN6	5.0×10^{-3} torr (หรือช่วงความดัน $4.0 - 6.0 \times 10^{-3}$ torr)

3.2.5 เริ่มเข้าสู่ชั้นตอนของระบบไฟฟ้า

จ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาด 450 โวลท์ จาก arc power supply ไปยังหัวกำเนิดพลาasma (plasma source) ให้เกิดการอาร์คภายในไตรเจนในความดันต่ำๆ กัน

แรงดันไฟฟ้าบานได้ เมื่อวัดกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายแรงดันด้วยเครื่องวัดอสซิลโลสโคป ได้ค่าประมาณ 500 A และให้แรงดันไฟฟ้าลบคงที่ขนาด 1 กิโลโวลต์จาก Bias power supply กับชิ้นงานเพื่อช่วยดึงไอออนบวกในพลาสมาวงเข้ามาเกะกะที่ผู้ชิ้นงานได้ดีขึ้น จากนั้นจุดอาร์คพลาสมากองไหเทเนียมภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน ที่ความดันกล่าว ผ่านฟลเตอร์และวัดค่ากระแสอาร์คขณะทำการทดลองด้วยเครื่องวัดอสซิลโลสโคป แต่ละชิ้นงานทำการจุดอาร์คพลาสมากองไหเทเนียมเป็นเวลา 70 นาที หลังการเคลือบผิวแล้ว ปล่อยชิ้นงานไว้ในบรรยากาศของไนโตรเจนเพื่อให้เย็นลง จึงนำออกจากอุโมงค์ทดลอง โดยสรุปตัวแปรที่ใช้ในการทดลองดังตาราง 3.2

ตารางที่ 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการเคลือบผิวชิ้นงาน

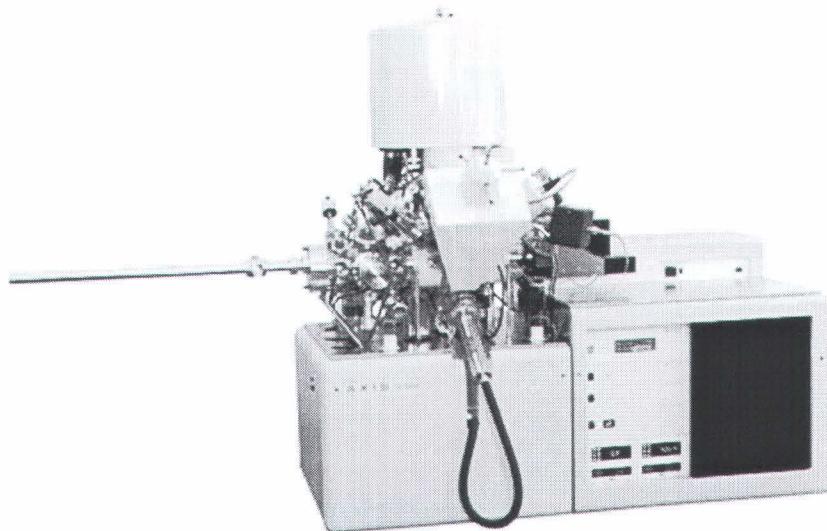
Technique parameters	Value
Base pressure (torr)	2.0×10^{-5}
Gas atmosphere	Pure N ₂
Gas pressure (torr)	$10^{-5} - 10^{-3}$
Arc voltage (V)	450
Magnetic coil current (A)	250
Substrate Bias (kV)	1
Deposition time	1h 10 min

3.3 วิเคราะห์คุณสมบัติของพิล็อต

3.3.1 ตรวจสอบโครงสร้างโดยการวัดจำนวนโฟโตอิมิชันด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ X-ray Photoelectron Spectroscopy รุ่น Axis Ultra ผลิตจากบริษัท Kratos Analytical Ltd. ดังรูป 3.8 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รังสีเอกซ์พลังงานเดียวผลิตจากหลอดที่เป้าแอนโอดทำด้วยโลหะ Al Ka มี พลังงาน 1486.6 eV

การส่องผิวน้ำของชิ้นงานที่เคลือบผิวจากเครื่อง XPS แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ survey ซึ่งเป็นการส่องโดยรวมเพื่อค้นหาว่ามีธาตุใดในชิ้นงานตั้งแต่ระดับพลังงาน 0 eV ถึง 1,200 eV จากนั้นจะเลือกช่วงระดับพลังงานที่จะเอียดขึ้น ระดับพลังงานเหล่านี้จะบ่งชี้ว่าเป็นธาตุใดและสามารถวิเคราะห์หาลักษณะการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุล เรียกว่าการส่อง high resolution โดยตรวจสอบธาตุทั้งหมด 4 ธาตุ ได้แก่ Ti2p, N1s, O1s และ C1s



รูปที่ 3.8 เครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy

3.3.2 ตรวจสอบความหนาและลักษณะทางกายภาพ

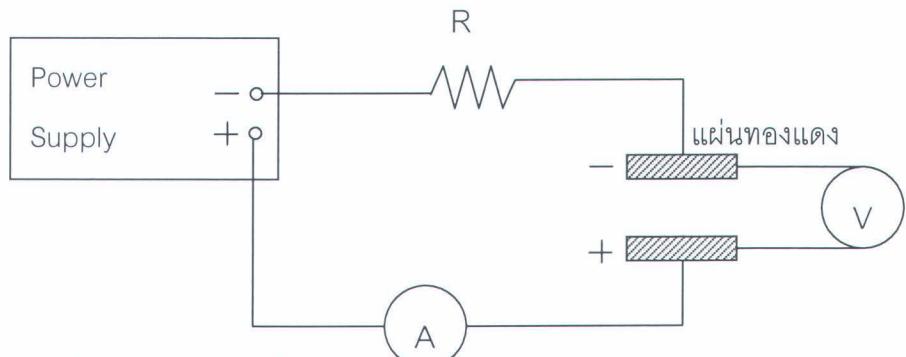
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) รุ่น JEOL JSM-6335F ที่ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ในการทดสอบโครงสร้างทางจุลภาคของผิวน้ำของฟิล์มบนแผ่นซิลิกอน และตรวจสอบความหนาด้วยภาพถ่ายหน้าตัดของชิ้นงานที่เกิดจากการหักแผ่นซิลิกอน

3.3.3 ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัส (interfacial contact resistance ; ICR)

ความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสอ้างอิงจากวิธีการของ Davies [8,9] ดังแผนภาพในรูปที่ 3.10 โดยชิ้นงานขนาด $2 \times 2 \text{ cm}^2$ ถูกประับด้วยกระดาษคาร์บอน (Toray carbon paper TGD-H-120) ซึ่งทำงานคล้ายกับ Gas diffusion layer (GDL) และปิดหัวท้ายด้วยแผ่นทองแดงทำหน้าที่เป็นขี้ไฟฟ้า ทำการทดสอบความสะอาดแผ่นทองแดงด้วย.ethanol ลอกออกโดยตลอดทุกครั้ง และในการคำนวณความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสจะทดลองภายใต้แรงกดตั้งแต่ $12.5 - 325 \text{ N} \cdot \text{cm}^2$ จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้า (I) ระหว่างแผ่นทั้งหมดที่ประับกันและวัดศักย์ไฟฟ้า (V) เพื่อคำนวณความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสรวม (R_{tot}) จากสมการ (1)

$$R_{\text{tot}} = \frac{VA_s}{I} \quad (1)$$

โดยที่ต่อวงจรทางไฟฟ้าดังรูปที่ 3.9 และจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 1 A และ A_s คือพื้นที่ผิวน้ำหน้าตัดของชิ้นงานซึ่งเท่ากับ $2 \times 2 \text{ cm}^2$



รูปที่ 3.9 วงจรไฟฟ้าเพื่อทดสอบความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัส

การทดลองนี้ต้องการทราบค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัส (ICR) ของพิล์มนางไทเทเนียมในไตรด์กับกระดาษคาร์บอนของแต่ละชิ้นงาน (R_{TiN-C}) และจำเป็นต้องรู้ค่าต่างๆ ดังนี้

ก. บล็อกรีซิสเทนซ์ (Bulk resistance) ของแผ่นทองแดง; R_{Cu} , แผ่นสเตนเลสสตีล 304; R_{ss} และ กระดาษคาร์บอน; R_C

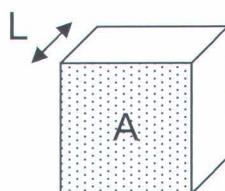
ข. ความต้านทานเชิงสัมผัสระหว่างแผ่นทองแดงกับกระดาษคาร์บอน; R_{Cu-C} และ กระดาษคาร์บอนกับแผ่นสเตนเลสสตีล 304; R_{C-ss}

บล็อกรีซิสเทนซ์ เป็นค่าคงที่ คำนวณจากสมการ (2)

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (2)$$

โดยที่ ρ คือ resistivity ของชิ้นงาน, L คือความยาวของแผ่นชิ้นงาน A คือ พื้นที่หน้าตัดของแผ่นชิ้นงานซึ่งคงที่เท่ากับ $2 \times 2 \text{ cm}^2$ ดังแผนภาพในรูปที่ 3.10

เมื่อคำนวณตามสมการ (2) ได้ค่าดังตาราง 3.3



รูปที่ 3.10 แผนภาพของชิ้นงาน

ตาราง 3.3 แสดงค่าคงที่และความต้านทานของแผ่นทองแดง กระแสการ์บอน และแผ่นสแตนเลส

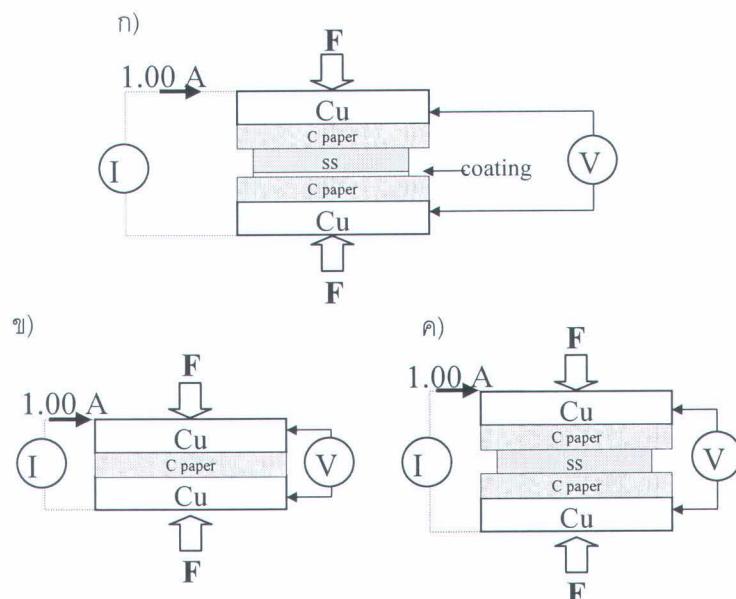
parameter material	$\rho(\Omega \cdot \text{cm})$	L (cm)	$\frac{L}{A} (\text{cm}^{-1})$	R (Ω)
Cu	0.00000167	0.2	0.05	8.35E-08
C	0.08	0.037	0.00925	0.00074
ss	0.000072	0.1	0.025	0.0000018

$$R_{\text{tot}}(\eta) = 2R_{\text{Cu}} + 2R_C + R_{\text{ss}} + 2R_{\text{Cu-C}} + R_{\text{C-ss}} + R_{\text{TiN-C}} \quad (3)$$

$$R_{\text{tot}}(\psi) = 2R_{\text{Cu}} + R_C + 2R_{\text{Cu-C}} \quad (4)$$

$$R_{\text{tot}}(\eta) = 2R_{\text{Cu}} + 2R_C + R_{\text{ss}} + 2R_{\text{Cu-C}} + R_{\text{C-ss}} \quad (5)$$

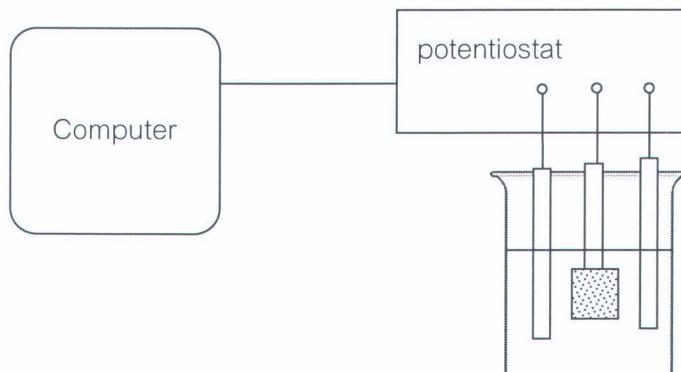
เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสระหว่างฟิล์มบางไบทเนียมกับกระแสการ์บอน; $R_{\text{TiN-C}}$ ทดลองโดยการต่ออุปกรณ์ดังรูปที่ 3.11ก และคำนวณโดยใช้สมการที่ 3 ซึ่งมีตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่า ดังนั้นจึงต้องมีการทดลองหาค่า $R_{\text{Cu-C}}$ และ $R_{\text{C-ss}}$ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ดังรูปที่ 3.11ข และ 3.11ก และใช้สมการที่ 4 และ 5 ในการคำนวณค่าดังกล่าวตามลำดับ



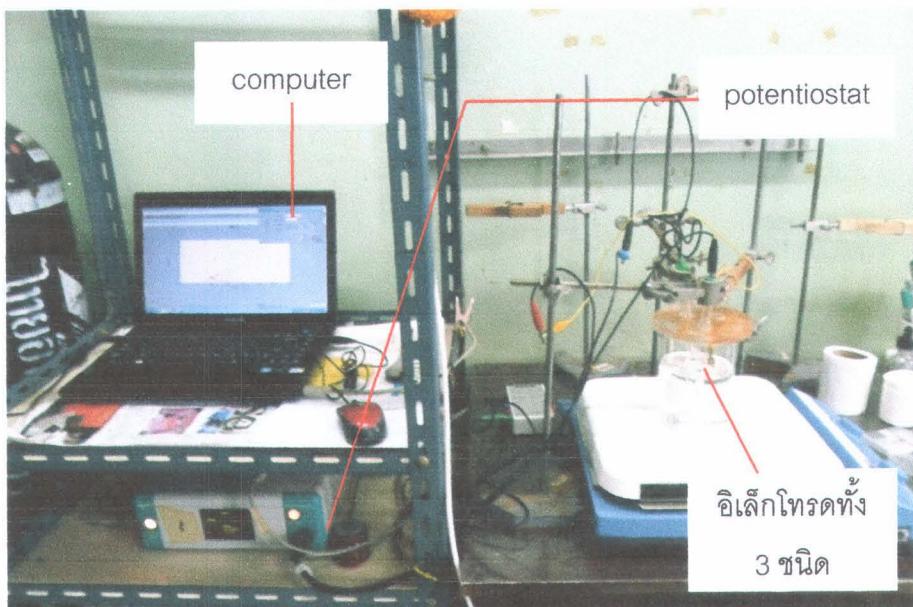
รูปที่ 3.11 แผนภาพการทดลองเพื่อหาค่า ICR (ก) ชิ้นงานถูกประกอบด้วยกระแสการ์บอนและแผ่นทองแดง (ข) กระแสการ์บอนถูกประกอบด้วยแผ่นทองแดง (ค) แผ่นสแตนเลส 304 ถูกประกอบด้วยกระแสการ์บอนและแผ่นทองแดง

3.3.4 ทดสอบการกัดกร่อนโดยวิธีโพแทนติโวไซดานามิกส์

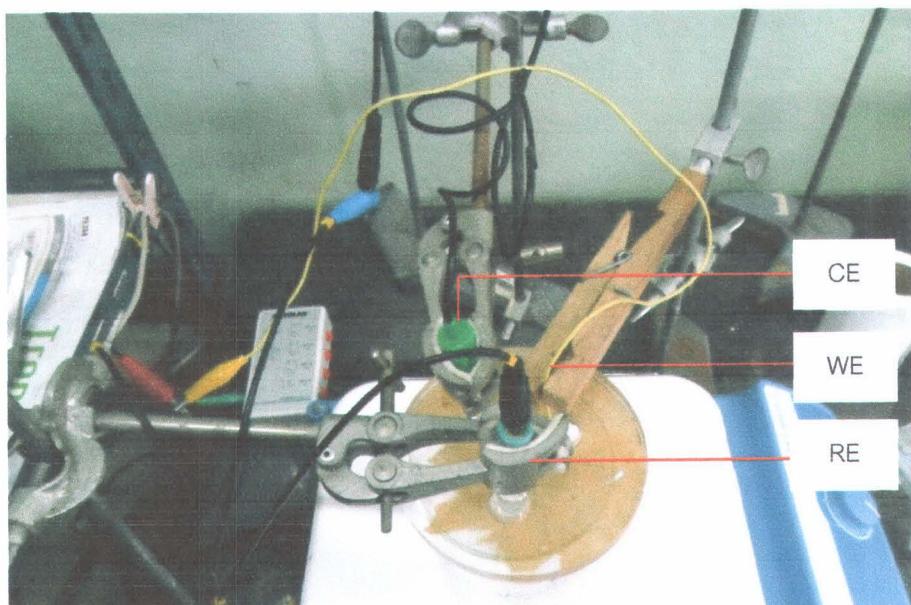
การทดลองนี้ต้องการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานในสารละลายน้ำกรดซัลฟูริกหนึ่งโมลा ($1M H_2SO_4$) ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งวัดค่า pH ได้ประมาณ 2 – 3 ชิ้นงานจะถูกเคลือบด้านหลัง และด้านข้างด้วยน้ำยาทาเล็บ Dodwell nail enamel ของ บจก.บีอีนอินเตอร์ โปรดักส์ เพื่อให้เหลือพื้นที่ที่ต้องการทดสอบการกัดกร่อนมีเพียงด้านที่เคลือบพิวเท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ μ Autolab type II potentiostat ทำหน้าที่ป้อนศักย์ไฟฟ้าเข้าสู่ชิ้นงาน และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชิ้นงาน โดยการเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยซอฟแวร์ Autolab ในรูปที่ 3.12 จะเห็นว่า มีอิเล็กโทรดสามชนิดต่อเข้ากับเครื่องโพแทนติโวสแตต ได้แก่ Reference electrode: RE ในการทดลองใช้ชนิด saturated calomel electrode (SCE), counter electrode: CE ใช้ชนิด platinum plate และ working electrode: WE ใช้เป็นชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ อิเล็กโทรดทั้งสามชนิดถูกจุ่มลงในน้ำมีกเกอร์ที่บรรจุสารละลายน้ำกรดซัลฟูริก เพื่อเข้าสู่การป้อนศักย์ไฟฟ้าแบบ โอดิเพนเซกติก โพแทน เชียล (open circuit potential: OCP) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นศักย์ไฟฟ้าจะเริ่มถูกบันทึกได้เป็นกราฟโพราไรเซชันซึ่งมี scanning rate เท่ากับ $1 mV/s$ และมีพื้นที่ผิวการกัดกร่อนเท่ากับ $3 cm^2$



รูปที่ 3.12 แผนภาพการทดสอบการกัดกร่อน



รูปที่ 3.13 เครื่องมือและอุปกรณ์ขณะทำการทดสอบหาค่าความกัดกร่อน (1)



รูปที่ 3.14 เครื่องมือและอุปกรณ์ขณะทำการทดสอบหาค่าความกัดกร่อน (2)